

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21919-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 06.10.2022

Ausstellungsdatum: 06.10.2022

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

**Horst Schirmer, Inhaber: Eyk Schirmer e.K.
Duchrother Straße 41, 12559 Berlin**

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Mindestanforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, um die nachfolgend aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische Messgrößen
– **Waagen**^{a)}

^{a)} nur Vor-Ort-Kalibrierung

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-21919-01-00

Vor-Ort-Kalibrierung

Messgröße / Kalibriergegenstand	Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)			
	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Waagen nichtselbsttätige elektronische Waagen	bis 10 kg	EURAMET Calibration Guide No. 18, Version 4.0	$1 \cdot 10^{-6}$	mit Gewichtsstücken nach OIML R-111-1:2004, gemäß Klasse E ₂
	bis 64 kg		$1 \cdot 10^{-5}$	mit Gewichtsstücken nach OIML R-111-1:2004, gemäß Klasse F ₁
	bis 600 kg		$1 \cdot 10^{-4}$	mit Gewichtsstücken nach OIML R-111-1:2004, gemäß Klasse M ₁

Verwendete Abkürzungen:

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
EURAMET	European Association of National Metrology Institutes
OIML	International organization of legal metrology